

傾角式雙極質譜儀

本院覽號

28A-950613B

公告日期

智財權狀態

美國8,309,913放棄維護、台灣(發明)I421901放棄維護、PCT已申請

摘要

本質譜技術可檢測表面樣品之全質譜資訊，不需切換質譜儀電性。此方法對於生物質譜影像分析具有最高之偵測效率，使所有重要之樣品結構資訊可於單一次檢測時完整記錄。傳統質譜儀必須以多次分析，甚至以多份樣品重複記錄才可達到，如此嚴重降低結果之可信度。本質譜技術包含新穎之離子源設計與傾角式質譜分析器結構，除縮小儀器體積，也達到靈敏度與穩定性增加之優勢。

技術優勢

同步雙電性分析，大幅增加動態範圍 (dynamic range) 沒有電性選擇問題，可在單一量測時收集所有可用質譜資訊 適合分子影像分析 減少樣品用量 加快分析時間 提供正負離子相互關係 增加定性與定量分析可信度

應用範圍

表面分析、生化分析、生物標記搜尋、物理化學研究。

創作人

王亦生、陳仲瑄



中央研究院
ACADEMIA SINICA